МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»
(ТУСУР)

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента по УР
_____Ким М.Ю.
«29» _____10_____ 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

МИКРОСХЕМОТЕХНИКА

Уровень образования: **высшее образование - бакалавриат**
Направление подготовки / специальность: **11.03.04 Электроника и наноэлектроника**
Направленность (профиль) / специализация: **Электроника, микроэлектроника и программирование цифровых устройств**
Форма обучения: **очная**
Факультет: **Институт радиоэлектронной техники (ИРЭТ)**
Кафедра: **институт радиоэлектронной техники (ИРЭТ)**
Курс: **3**
Семестр: **6**
Учебный план набора 2026 года

Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Виды учебной деятельности	6 семестр	Всего	Единицы
Лекционные занятия	26	26	часов
Практические занятия	18	18	часов
Лабораторные занятия	16	16	часов
Самостоятельная работа	48	48	часов
Общая трудоемкость (включая промежуточную аттестацию)	108	108	часов
	3	3	з.е.

Формы промежуточной аттестации	Семестр
Зачет с оценкой	6

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ким М.Ю.
Должность: Директор департамента по УР
Дата подписания: 29.10.2025
Уникальный программный ключ:
ed789cd8-2cc6-4431-a59e-8f386b1d44fa

Томск

Согласована на портале № 84167

1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

1. Ознакомление с основными направлениями развития современной микроэлектроники.
2. Приобретение знаний по принципам разработки и исследования микроэлектронной аппаратуры различного функционального назначения, включая устройства и системы промышленной электроники.

1.2. Задачи дисциплины

1. Формирование знаний о предмете, принципах, современных и перспективных направлениях развития микросхемотехники интегральных схем.
2. Формирование знаний о назначении, характеристиках и параметрах цифровых и аналоговых интегральных микросхем.
3. Формирование навыков синтеза, анализа и моделирования микроэлектронной аппаратуры с использованием средств автоматизированного проектирования, а также расчета электрических параметров и характеристик базовых логических элементов и их экспериментального исследования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Часть блока дисциплин: Обязательная часть.
Модуль дисциплин: Модуль направления подготовки (special hard skills – SHS).
Индекс дисциплины: Б1.О.03.04.
Реализуется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
Универсальные компетенции		
-	-	-
Общепрофессиональные компетенции		

Согласована на портале № 84167

ОПК-1. Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности	ОПК-1.1. Знает фундаментальные законы естественных наук и математики	Знает законы электрического поля, законы цепей постоянного тока, связь между токами и напряжениями на полюсах активных электронных компонентов, дифференциальное и интегральное исчисления.
	ОПК-1.2. Умеет анализировать проблемы, процессы и явления в области физики, использовать на практике базовые знания и методы физических исследований, а также умеет применять методы решения математических задач в профессиональной области	Умеет анализировать процессы в функциональных узлах цифровых и аналоговых микроэлектронных структур, а также формировать математические модели для исследования характеристик и параметров цифровых микроэлектронных структур в частотной и временной области.
	ОПК-1.3. Владеет практическими навыками решения инженерных задач	Владеет навыками разработки методик расчета параметров и характеристик основных функциональных узлов цифровых и аналоговых интегральных микросхем.
Профессиональные компетенции		
ПК-3. Способен выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования	ПК-3.1. Знает принципы конструирования отдельных аналоговых блоков электронных приборов	Знает принципы схемотехники цифровых и аналоговых интегральных схем.
	ПК-3.2. Умеет проводить оценочные расчеты характеристик электронных приборов	Умеет проводить оценочные расчеты характеристик и параметров базовых схем элементов ТТЛ-логики, элементов на переключателях тока, элементов на МДП-транзисторах, а также функциональных элементов аналоговых интегральных микросхем.
	ПК-3.3. Владеет навыками подготовки принципиальных и монтажных электрических схем	Владеет навыками составления схем электрических структурных, функциональных и принципиальных. Владеет навыками составления монтажных схем, на которых указывается геометрическое расположение отдельных узлов электронной техники и связь между ними.

Согласована на портале № 84167

ПК-9. Способен к применению современных технологических процессов и технологического оборудования на этапах разработки и производства изделий микроэлектроники и твердотельной электроники	ПК-9.1. Знает основное технологическое оборудование для производства изделий электронной техники	Знает основное технологическое оборудование для нанесения, удаления и модифицирования материалов при создании элементной базы микроэлектроники.
	ПК-9.2. Умеет обосновывать выбор технологического процесса и оборудования для его реализации	Умеет выбирать оптимальные технологические процессы, их последовательность и контрольно-измерительные операции для производства изделий микроэлектроники.
	ПК-9.3. Владеет навыками практической работы на технологическом оборудовании	Владеет навыками практической работы на современном оборудовании для реализации основных технологических процессов при производстве изделий микроэлектроники и твердотельной электроники.

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов.

Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной деятельности представлено в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности

Виды учебной деятельности	Всего часов	Семестры
		6 семестр
Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем, всего	60	60
Лекционные занятия	26	26
Практические занятия	18	18
Лабораторные занятия	16	16
Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. контактная внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем, всего	48	48
Подготовка к зачету с оценкой	31	31
Подготовка к тестированию	13	13
Подготовка к лабораторной работе, написание отчета	4	4
Общая трудоемкость (в часах)	108	108
Общая трудоемкость (в з.е.)	3	3

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы (темы) дисциплины и виды учебной деятельности

Структура дисциплины по разделам (темам) и видам учебной деятельности приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Разделы (темы) дисциплины и виды учебной деятельности

Названия разделов (тем) дисциплины	Лек. зан., ч	Прак. зан., ч	Лаб. раб.	Сам. раб., ч	Всего часов (без экзамена)	Формируемые компетенции
6 семестр						
1 Методологические основы анализа и проектирования интегральных микросхем.	2	2	-	3	7	ОПК-1, ПК-3

Согласована на портале № 84167

2 Характеристики и параметры интегральных микросхем.	2	-	-	2	4	ОПК-1, ПК-3
3 Элементы интегральных микросхем.	4	2	-	3	9	ОПК-1, ПК-3, ПК-9
4 Функциональные узлы цифровых интегральных микросхем.	4	2	-	8	14	ОПК-1, ПК-3
5 Схемотехника цифровых микроэлектронных структур.	6	6	-	14	26	ОПК-1, ПК-3
6 Комбинационные и последовательностные микроэлектронные структуры.	4	2	4	6	16	ОПК-1, ПК-3
7 Основные функциональные узлы аналоговой интегральной микроэлектроники.	4	4	12	12	32	ОПК-1, ПК-3, ПК-9
Итого за семестр	26	18	16	48	108	
Итого	26	18	16	48	108	

5.2. Содержание разделов (тем) дисциплины

Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям) приведено в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям)

Названия разделов (тем) дисциплины	Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям)	Трудоемкость (лекционные занятия), ч	Формируемые компетенции
6 семестр			
1 Методологические основы анализа и проектирования интегральных микросхем.	Основные и специальные функции микроэлектронных структур. Принципы схемотехники интегральных микросхем. Процесс проектирования интегральных микросхем. Классификация интегральных микросхем.	2	ОПК-1, ПК-3
	Итого	2	
2 Характеристики и параметры интегральных микросхем.	Схемотехнические и конструктивные параметры ЦИМС. Статические характеристики и параметры ЦИМС. Динамические характеристики и параметры ЦИМС. Энергетические характеристики и параметры ЦИМС. Характеристики и параметры интегральных операционных усилителей.	2	ОПК-1, ПК-3
	Итого	2	
3 Элементы интегральных микросхем.	Резисторы и конденсаторы интегральных микросхем. Диоды интегральных микросхем. Многоэмиттерный транзистор. Составные транзисторы.	4	ОПК-1, ПК-3, ПК-9
	Итого	4	

Согласована на портале № 84167

4 Функциональные узлы цифровых интегральных микросхем.	Элементарный диодный ключ. Многовходовой диодный ключ. Транзисторные ключи на биполярных транзисторах. МДП-транзисторные ключи. Переключатель тока. Бистабильные ячейки.	4	ОПК-1, ПК-3
	Итого	4	
5 Схемотехника цифровых микроэлектронных структур.	Диодно-транзисторные логические элементы. Транзисторно-транзисторные логические элементы. Логические элементы ТТЛ с диодами и транзисторами Шоттки. Транзисторные логические элементы на переключателях тока. Логические элементы на комплементарных МДП-транзисторах.	6	ОПК-1, ПК-3
	Итого	6	
6 Комбинационные и последовательностные микроэлектронные структуры.	Элементы анализа и синтеза цифровых микроэлектронных структур. Цифровые микроэлектронные структуры комбинационного типа. Цифровые микроэлектронные структуры последовательностного типа. Особенности выходов логических элементов ТТЛ.	4	ОПК-1, ПК-3
	Итого	4	
7 Основные функциональные узлы аналоговой интегральной микроэлектроники.	Источники постоянного тока. Источники постоянного напряжения. Дифференциальные усилители. Выходные каскады. Интегральные операционные усилители и их основные свойства.	4	ОПК-1, ПК-3
	Итого	4	
Итого за семестр		26	
Итого		26	

5.3. Практические занятия (семинары)

Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 5.3.

Таблица 5.3. – Наименование практических занятий (семинаров)

Названия разделов (тем) дисциплины	Наименование практических занятий (семинаров)	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
6 семестр			
1 Методологические основы анализа и проектирования интегральных микросхем.	Преобразование, минимизация и техническая реализация булевых функций.	2	ПК-3
	Итого	2	
3 Элементы интегральных микросхем.	Определение параметров интегральных резисторов и конденсаторов.	2	ПК-3
	Итого	2	

Согласована на портале № 84167

4 Функциональные узлы цифровых интегральных микросхем.	Расчет статических параметров транзисторных ключей интегральных микросхем на биполярных и МДП-транзисторах.	2	ПК-3
	Итого	2	
5 Схемотехника цифровых микроэлектронных структур.	Расчет статических параметров цифровых микроэлектронных структур: базового логического транзисторно-транзисторной логики с корректирующей цепочкой, элемента И-НЕ на МДП-транзисторах, базовых логических элементов на переключателях тока.	6	ПК-3
	Итого	6	
6 Комбинационные и последовательностные микроэлектронные структуры.	Методика синтеза микроэлектронной структуры последовательностного типа.	2	ПК-3
	Итого	2	
7 Основные функциональные узлы аналоговой интегральной микроэлектроники.	Расчет источников постоянного тока и постоянного напряжения.	4	ПК-3, ПК-9
	Итого	4	
Итого за семестр		18	
Итого		18	

5.4. Лабораторные занятия

Наименование лабораторных работ приведено в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Наименование лабораторных работ

Названия разделов (тем) дисциплины	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
6 семестр			
6 Комбинационные и последовательностные микроэлектронные структуры.	Синтез синхронного счетчика с заданной последовательностью смены состояний.	4	ПК-3
	Итого	4	
7 Основные функциональные узлы аналоговой интегральной микроэлектроники.	Исследование интегральных источников постоянного тока на биполярных транзисторах.	4	ПК-3
	Исследование интегральных источников постоянного напряжения.	4	ПК-3
	Исследования интегрального логического элемента И-НЕ транзисторно-транзисторной логики со сложным инвертором и корректирующей цепочкой	4	ПК-3
	Итого	12	
Итого за семестр		16	
Итого		16	

Согласована на портале № 84167

5.5. Курсовой проект / курсовая работа

Не предусмотрено учебным планом

5.6. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в таблице 5.6.

Таблица 5.6. – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции

Названия разделов (тем) дисциплины	Виды самостоятельной работы	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции	Формы контроля
6 семестр				
1 Методологические основы анализа и проектирования интегральных микросхем.	Подготовка к зачету с оценкой	2	ПК-3	Зачёт с оценкой
	Подготовка к тестированию	1	ПК-3	Тестирование
	Итого	3		
2 Характеристики и параметры интегральных микросхем.	Подготовка к зачету с оценкой	1	ОПК-1, ПК-3	Зачёт с оценкой
	Подготовка к тестированию	1	ОПК-1, ПК-3	Тестирование
	Итого	2		
3 Элементы интегральных микросхем.	Подготовка к зачету с оценкой	2	ПК-3	Зачёт с оценкой
	Подготовка к тестированию	1	ПК-3	Тестирование
	Итого	3		
4 Функциональные узлы цифровых интегральных микросхем.	Подготовка к зачету с оценкой	6	ПК-3	Зачёт с оценкой
	Подготовка к тестированию	2	ПК-3	Тестирование
	Итого	8		
5 Схемотехника цифровых микроэлектронных структур.	Подготовка к зачету с оценкой	10	ПК-3	Зачёт с оценкой
	Подготовка к тестированию	4	ПК-3	Тестирование
	Итого	14		
6 Комбинационные и последовательностные микроэлектронные структуры.	Подготовка к зачету с оценкой	2	ПК-3	Зачёт с оценкой
	Подготовка к тестированию	2	ПК-3	Тестирование
	Подготовка к лабораторной работе, написание отчета	2	ПК-3	Лабораторная работа
	Итого	6		

Согласована на портале № 84167

7 Основные функциональные узлы аналоговой интегральной микроэлектроники.	Подготовка к зачету с оценкой	8	ПК-3	Зачёт с оценкой
	Подготовка к тестированию	2	ПК-3	Тестирование
	Подготовка к лабораторной работе, написание отчета	2	ПК-3	Лабораторная работа
	Итого	12		
Итого за семестр		48		
Итого		48		

5.7. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий представлено в таблице 5.7.

Таблица 5.7 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Формируемые компетенции	Виды учебной деятельности				Формы контроля
	Лек. зан.	Прак. зан.	Лаб. раб.	Сам. раб.	
ОПК-1	+			+	Зачёт с оценкой, Тестирование
ПК-3	+	+	+	+	Зачёт с оценкой, Лабораторная работа, Тестирование
ПК-9	+	+			Зачёт с оценкой, Тестирование

6. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся

6.1. Балльные оценки для форм контроля

Балльные оценки для форм контроля представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Балльные оценки

Формы контроля	Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра	Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ	Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра	Всего за семестр
6 семестр				
Зачёт с оценкой	0	0	30	30
Лабораторная работа	0	10	30	40
Тестирование	5	10	15	30
Итого максимум за период	5	20	75	100
Нарастающим итогом	5	25	100	100

6.2. Пересчет баллов в оценки за текущий контроль

Пересчет баллов в оценки за текущий контроль представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Пересчет баллов в оценки за текущий контроль

Баллы на дату текущего контроля	Оценка
≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату ТК	5
От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату ТК	4
От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату ТК	3

Согласована на портале № 84167

< 60% от максимальной суммы баллов на дату ТК	2

6.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Оценка	Итоговая сумма баллов, учитывает успешно сданный экзамен	Оценка (ECTS)
5 (отлично) (зачтено)	90 – 100	A (отлично)
4 (хорошо) (зачтено)	85 – 89	B (очень хорошо)
	75 – 84	C (хорошо)
	70 – 74	D (удовлетворительно)
3 (удовлетворительно) (зачтено)	65 – 69	
	60 – 64	E (посредственно)
2 (неудовлетворительно) (не зачтено)	Ниже 60 баллов	F (неудовлетворительно)

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература

1. Игнатов, А. Н. Микросхемотехника и наноэлектроника : учебное пособие / А. Н. Игнатов. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 528 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/210695 .

7.2. Дополнительная литература

1. Кожухов, В. В. Электронные цепи и микросхемотехника. Импульсные и цифровые устройства. Конспект лекций: учебное пособие / В. В. Кожухов. — Новосибирск: НГТУ, 2021. — 166 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/306452.

7.3. Учебно-методические пособия

7.3.1. Обязательные учебно-методические пособия

1. Легостаев Н.С. Микросхемотехника. Цифровая микросхемотехника: учеб-метод.пособие /Н.С. Легостаев, К.В. Четвергов; под ред. П.Е. Трояна.- Томск: Томск. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. - 123 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 100 экз.).

2. Микросхемотехника: Методические указания по выполнению лабораторных работ / Н. С. Легостаев, Р. Ю. Куркин - 2026. 51 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/11297.

3. Дыбко М.А. Цифровая микроэлектроника: Учебное пособие / М.А. Дыбко, А.В. Удовиченко, А.Г. Волков. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2019. – 200 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://reader.lanbook.com/book/152139#2.

7.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

Для лиц с нарушениями зрения:

– в форме электронного документа;

– в печатной форме увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушениями слуха:

– в форме электронного документа;

– в печатной форме.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

– в форме электронного документа;

Согласована на портале № 84167

– в печатной форме.

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

При изучении дисциплины рекомендуется обращаться к современным базам данных, информационно-справочным и поисковым системам, к которым у ТУСУРа открыт доступ: https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh.

8. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

8.1. Материально-техническое и программное обеспечение для лекционных занятий

Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория с достаточным количеством посадочных мест для учебной группы, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются мультимедийное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.

8.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий

Лаборатория микропроцессорных устройств и систем / Лаборатория ГПО: учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, помещение для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 333 ауд.

Описание имеющегося оборудования:
- Лабораторные макеты (10 шт.);
- Микропроцессорный модуль «SDK-1.1» (8 шт.);
- Осциллографы (12 шт.);
- Генератор сигналов Г3-54 (2 шт.);
- Компьютер Intel(R) Core (TM)2 CPU (12 шт.);
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.

Программное обеспечение:
- ASIMEC;
- Far Manager;
- Google Chrome;
- LTspice 4;
- Microsoft Visio 2010;
- Mozilla Firefox;
- Windows XP Pro;

8.3. Материально-техническое и программное обеспечение для лабораторных работ

Вычислительная лаборатория: учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, помещение для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 201б ауд.

Описание имеющегося оборудования:
- Персональные компьютеры (16 шт.);
- Интерактивная доска – «Smart-board» DViT (1 шт.);
- Мультимедийный проектор NEC (1 шт.);
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.

Программное обеспечение:
- Asimec;
- Far Manager;
- Google Chrome;
- LTspice 4;

Согласована на портале № 84167

- Microsoft Visio 2013;
- PTC Mathcad 13, 14;
- Windows XP;
- Анализатор трафика Wireshark;

8.4. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы

Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы), расположенные по адресам:

- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 101 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 107 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 130 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- учебная мебель;
- компьютеры;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду ТУСУРа.

Перечень программного обеспечения:

- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.

8.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.

При занятиях с обучающимися с **нарушениями слуха** предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.

При занятиях с обучающимися с **нарушениями зрения** предусмотрено использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.

При занятиях с обучающимися с **нарушениями опорно-двигательного аппарата** используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.

9. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения дисциплины

9.1. Содержание оценочных материалов для текущего контроля и промежуточной аттестации

Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной компетенций используются оценочные материалы, представленные в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Формы контроля и оценочные материалы

Названия разделов (тем) дисциплины	Формируемые компетенции	Формы контроля	Оценочные материалы (ОМ)

Согласована на портале № 84167

1 Методологические основы анализа и проектирования интегральных микросхем.	ОПК-1, ПК-3	Зачёт с оценкой	Перечень вопросов для зачета с оценкой
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
2 Характеристики и параметры интегральных микросхем.	ОПК-1, ПК-3	Зачёт с оценкой	Перечень вопросов для зачета с оценкой
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
3 Элементы интегральных микросхем.	ОПК-1, ПК-3, ПК-9	Зачёт с оценкой	Перечень вопросов для зачета с оценкой
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
4 Функциональные узлы цифровых интегральных микросхем.	ОПК-1, ПК-3	Зачёт с оценкой	Перечень вопросов для зачета с оценкой
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
5 Схемотехника цифровых микроэлектронных структур.	ОПК-1, ПК-3	Зачёт с оценкой	Перечень вопросов для зачета с оценкой
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
6 Комбинационные и последовательностные микроэлектронные структуры.	ОПК-1, ПК-3	Зачёт с оценкой	Перечень вопросов для зачета с оценкой
		Лабораторная работа	Темы лабораторных работ
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
7 Основные функциональные узлы аналоговой интегральной микроэлектроники.	ОПК-1, ПК-3, ПК-9	Зачёт с оценкой	Перечень вопросов для зачета с оценкой
		Лабораторная работа	Темы лабораторных работ
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий

Шкала оценки сформированности отдельных планируемых результатов обучения по дисциплине приведена в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Шкала оценки сформированности планируемых результатов обучения по дисциплине

Оценка	Баллы за ОМ	Формулировка требований к степени сформированности планируемых результатов обучения		
		знать	уметь	владеть
2 (неудовлетворительно)	< 60% от максимальной суммы баллов	отсутствие знаний или фрагментарные знания	отсутствие умений или частично освоенное умение	отсутствие навыков или фрагментарные применение навыков

Согласована на портале № 84167

3 (удовлетворительно)	от 60% до 69% от максимальной суммы баллов	общие, но не структурированные знания	в целом успешно, но не систематически осуществляемое умение	в целом успешное, но не систематическое применение навыков
4 (хорошо)	от 70% до 89% от максимальной суммы баллов	сформированные, но содержащие отдельные проблемы знания	в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение	в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы применение навыков
5 (отлично)	≥ 90% от максимальной суммы баллов	сформированные систематические знания	сформированное умение	успешное и систематическое применение навыков

Шкала комплексной оценки сформированности компетенций приведена в таблице 9.3.

Таблица 9.3 – Шкала комплексной оценки сформированности компетенций

Оценка	Формулировка требований к степени компетенции
2 (неудовлетворительно)	Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале или Знать на уровне **ориентирования**, представлений. Обучающийся знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
3 (удовлетворительно)	Знать и уметь на **репродуктивном** уровне. Обучающихся знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
4 (хорошо)	Знать, уметь, владеть на **аналитическом** уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
5 (отлично)	Знать, уметь, владеть на **системном** уровне. Обучающийся знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания дисциплины, его значимость в содержании дисциплины.

9.1.1. Примерный перечень тестовых заданий

1. Указать этап проектирования интегральных микросхем, на котором проверяется правильность
   функционирования синтезированной структуры.
   а) структурный синтез; б) структурный анализ; в) схемный синтез; г) схемный анализ.
2. Определить коэффициент функциональной интеграции счетчика, содержащего четыре триггера, в структуре
   каждого из которых выделяется 10 логических элементов И-НЕ.
   а) 1,218; б) 1,312; в) 1,602; г) 1,904.
3. Конъюнкция - это

Согласована на портале № 84167

а) булева функция, которая принимает единичное значение только на одном логическом наборе значений
аргументов, а на остальных логических наборах обращается в нуль.
б) булева функция, которая принимает нулевое значение только на одном логическом наборе значений
аргументов, а на остальных логических наборах обращается в единицу.
в) булева функция, которая обращается в нуль только в том случае, когда все аргументы равны нулю, и в единицу
на всех остальных наборах аргументов.
г) булева функция, которая обращается в единицу только в том случае, когда все аргументы равны единице, и в
нуль на всех остальных наборах аргументов.

4. Запись булевой функции в форме дизъюнкции отдельных членов, каждый из которых, в свою очередь, есть
некоторая функция, содержащая только конъюнкции и инверсии, является …
а) алгебраическим представлением булевой функции в дизъюнктивной форме.
б) алгебраическим представлением булевой функции в конъюнктивной форме.
в) дизъюнктивной нормальной формой представления булевой функции.
г) конъюнктивной нормальной формой представления булевой функции.
5. Определить в вольтах логический перепад, если значение выходного порогового напряжения логической "1"
14,9 В, а значение выходного порогового напряжения логического "0" 0,1 В.
а) 7,5 В; б) 9,3 В; в) 14,8 В; г) 15,0 В.
6. Определить в вольтах помехозащищенность по уровню логической «1», если уровень напряжения логической
"1" 14,9 В, а пороговое напряжение 9,2 В.
а) 3,4 В; б) 5,7 В; в) 9,2 В; г) 14,9 В.
7. Определить в наносекундах среднее время задержки распространения сигнала, если время задержки
распространения сигнала при включении составляет 10 нс, а время задержки распространения сигнала
при выключении 12 нс.
а) 2 нс; б) 10 нс; в) 11 нс; г) 12 нс.
8. Определить в мА средний ток, потребляемый интегральной микросхемой от источника питания, если средняя
статическая мощность потребления составляет 100 мВт, а напряжение источника питания 5 В.
а) 10 мА; б) 20 мА; в) 25 мА; г) 30 мА.
9. Определить ток коллектора составного p-n-p-транзистора, если ток базы составного транзистора 1 мкА,
статический коэффициент передачи тока базы p-n-p-транзистора 30, а статический коэффициент передачи
тока базы n-p-n-транзистора 49.
а) 1200 мкА; б) 1500 мкА; в) 3000 мкА; г) 4900 мкА.
10. Определить коэффициент передачи тока базы транзистора n-p-n-типа составного p-n-p-транзистора. Ток базы
составного транзистора 1,2 мкА, ток коллектора составного транзистора 1800 мкА, коэффициент передачи тока
базы p-n-p-транзистора в структуре составного 30.
а) 29; б) 31; в) 49; г) 51.

9.1.2. Перечень вопросов для зачета с оценкой

1. Чем обусловлено ограничение на сопротивление резисторов и емкости конденсаторов, применяемых в микроэлектронных структурах?
2. Какие структуры используются в качестве конденсаторных?
3. Почему при создании ИМС на переключателях тока не используют транзисторы с диодом

Согласована на портале № 84167

Шоттки?

4. Почему быстродействие интегрального составного p-n-p-транзистора определяется быстродействием p-n-p-транзистора?
5. Какие недостатки ЦАП на базе матрицы двоично-взвешенных резисторов во многом устранены в ЦАП на базе резистивной матрицы R-2R?

9.1.3. Темы лабораторных работ

1. Синтез синхронного счетчика с заданной последовательностью смены состояний.
2. Исследование интегральных источников постоянного тока на биполярных транзисторах.
3. Исследование интегральных источников постоянного напряжения.
4. Исследования интегрального логического элемента И-НЕ транзисторно-транзисторной логики со сложным инвертором и корректирующей цепочкой

9.2. Методические рекомендации

Учебный материал излагается в форме, предполагающей самостоятельное мышление студентов, самообразование. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.

Начать изучение дисциплины необходимо со знакомства с рабочей программой, списком учебно-методического и программного обеспечения. Самостоятельная работа студента включает работу с учебными материалами, выполнение контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом.

В процессе изучения дисциплины для лучшего освоения материала необходимо регулярно обращаться к рекомендуемой литературе и источникам, указанным в учебных материалах; пользоваться через кабинет студента на сайте Университета образовательными ресурсами электронно-библиотечной системы, а также общедоступными интернет-порталами, содержащими научно-популярные и специализированные материалы, посвященные различным аспектам учебной дисциплины.

При самостоятельном изучении тем следуйте рекомендациям:

– чтение или просмотр материала осуществляйте со скоростью, достаточной для индивидуального понимания и освоения материала, выделяя основные идеи; на основании изученного составить тезисы. Освоив материал, попытаться соотнести теорию с примерами из практики;

– если в тексте встречаются незнакомые или малознакомые термины, следует выяснить их значение для понимания дальнейшего материала;

– осмысливайте прочитанное и изученное, отвечайте на предложенные вопросы.

Студенты могут получать индивидуальные консультации, в т.ч. с использованием средств телекоммуникации.

По дисциплине могут проводиться дополнительные занятия, в т.ч. в форме вебинаров. Расписание вебинаров и записи вебинаров публикуются в электронном курсе / электронном журнале по дисциплине.

9.3. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 9.4.

Таблица 9.4 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Категории обучающихся	Виды дополнительных оценочных материалов	Формы контроля и оценки результатов обучения
С нарушениями слуха	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы	Преимущественно письменная проверка

Согласована на портале № 84167

С нарушениями зрения	Собеседование по вопросам к зачету, опрос по терминам	Преимущественно устная проверка (индивидуально)
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	Решение дистанционных тестов, контрольные работы, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету	Преимущественно дистанционными методами
С ограничениями по общемедицинским показаниям	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы, устные ответы	Преимущественно проверка методами, определяющимися исходя из состояния обучающегося на момент проверки

9.4. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

– в печатной форме;
– в печатной форме с увеличенным шрифтом;
– в форме электронного документа;
– методом чтения ассистентом задания вслух;
– предоставление задания с использованием сурдоперевода.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

– письменно на бумаге;
– набор ответов на компьютере;
– набор ответов с использованием услуг ассистента;
– представление ответов устно.

Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушениями слуха:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме.

При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

Согласована на портале № 84167

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ПрЭ
протокол № 33 от «23» 10 2025 г.

СОГЛАСОВАНО:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий выпускающей каф. ИРЭТ	А.М. Заболоцкий	Согласовано, 47c2d4ff-8c0e-484c-b856-20e4ba4f0e52
Заведующий обеспечивающей каф. ПрЭ	Д.О. Пахмурин	Согласовано, ce9e048a-2a49-44a0-b2ab-bc9421935400
Начальник учебного управления	Г.А. Цой	Согласовано, 8a5745e4-63a0-4946-bbb0-ce4977ac113e

ЭКСПЕРТЫ:

Заведующий кафедрой, каф. СВЧиКР	А.М. Заболоцкий	Согласовано, 47c2d4ff-8c0e-484c-b856-20e4ba4f0e52
Доцент, каф. ПрЭ	Д.О. Пахмурин	Согласовано, ce9e048a-2a49-44a0-b2ab-bc9421935400

РАЗРАБОТАНО:

Профессор, каф. ПрЭ	Н.С. Легостаев	Разработано, 6332ca5f-c16e-4579-bbc4-ee49773dfd8d

Согласована на портале № 84167